

115 年「AI 半導體設備及檢測實務研習營」職能深化課程表

課程日期：115 年 8 月 17 日(一)、115 年 8 月 18 日(二)、115 年 8 月 19 日(三)

課程地點：明新科技大學化材館 201 教室(新竹縣新豐鄉新興路 1 號)、Google meet

課程時間：09:00-18:00(報到時間 08:45-09:00；中午休息時間 12:00-13:00)

參加資格：全國大專校院之在學學生/預計招收實體 40 人、線上 200 人。

備註:本次研習課程為期 3 天，需參與全程課程，將於課程結束後核發研習時數證明。

課程內容：

日期	時間	課程名稱/課程內容	授課教師
8/17 (一)	08:45~09:00	報到	
	09:00~10:00	半導體與 AI 的發展關係	明新科技大學半導體工程與材料系 澹台富國助理教授 (交通大學電子研究所博士)
	10:00~11:00	光速革命:矽光子與 CPO 如何重塑 AI 未來十年(一)	
	11:00~12:00	光速革命:矽光子與 CPO 如何重塑 AI 未來十年(二)	
	12:00~13:00	午餐	
	13:00~14:00	製程資料與檢測資料格式	明新科技大學半導體工程與材料系 徐偉成助理教授 (交通大學電子研究所博士)
	14:00~15:00	SPC 與異常偵測基礎	
	15:00~16:00	AI 基礎：從規則判斷到機器學習	
	16:00~17:00	實作：製程資料異常分析	
	17:00~18:00	綜合討論	
8/18 (二)	08:45~09:00	報到	
	09:00~10:00	半導體缺陷類型與失效來源	明新科技大學半導體工程與材料系 徐偉成助理教授 (交通大學電子研究所博士)
	10:00~11:00	OM 與 SEM 影像判讀實務	
	11:00~12:00	AI 影像辨識基礎	
	12:00~13:00	午餐	
	13:00~14:00	缺陷影像資料集建立與標註	明新科技大學半導體工程與材料系 徐偉成助理教授 (交通大學電子研究所博士)
	14:00~15:00	實作：缺陷影像分類模型	
	15:00~16:00	缺陷偵測與 Wafer Map 分析	
	16:00~17:00	實作：Wafer Map 缺陷型態分類	
17:00~18:00	綜合討論		
8/19 (三)	08:45~09:00	報到	
	09:00~10:00	半導體設備健康監測介紹	明新科技大學半導體與光電科技系 楊雅曉助理教授 (中山大學機電所博士)
	10:00~11:00	半導體設備 Life time 預測模型	
	11:00~12:00	實案說明：Matching Box Remaining Useful Life	
	12:00~13:00	午餐	
	13:00~14:00	數據驅動的智慧檢測-基礎演算法	元智大學資工系 胡淑琮兼任助理教授 (交通大學資訊科學與工程研究所博士)
	14:00~15:00	數據驅動的智慧檢測-基礎演算法與 AI 應用入門	
	15:00~16:00	數據驅動的智慧檢測- AI 應用入門	
16:00~17:00	課程總結	明新科技大學半導體工程與材料系 徐偉成助理教授 交通大學電子研究所博士/	

活動聯絡人:教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學產學合作處/鄭景玲經理

連絡電話:(02)2771-2171 分機 6012，E-mail：clcheng@ntut.edu.tw

教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學產學合作處/黃澤淵專員

連絡電話:(02)2771-2171 分機 6023，E-mail：receivable0308@mail.ntut.edu.tw